

SEM 臨時開放使用規則

2003/8/16

日前 SEM 的 Y 軸故障，等待日本技師修復中，先將原本故障部分，修整之後，作為臨時使用。因為是部分修復，所以需請各實驗室遵守以下規則：

1. 即日起，開放見習者見習，需見習者一律需填寫 SEM 使用申請書，由指導老師簽名後，交給李良箴，方可以見習。
2. 所有已停權使用者的門禁卡，需使用 SEM 者，仍須填寫使用申請書，向李良箴申請，重新開卡使用。開卡後第一次使用，請聯絡良箴陪同，
3. 全面停用公用大型 Sample Holder。一律使用小型 Sample Holder。
4. NPGS 使用者，請將樣品緊接著法拉第環四周，黏貼樣品
5. Y 軸刻度僅能在 35 0 950 間移動，超過就會傷害 Y 軸。
6. 請共體時艱，確實遵守以上規則，使機台繼續使用。

SEM 使用者申請表

系級：

姓名：

申請人身份：☐見習者 ☐授權使用者

需使用機台之理由：

指導老師簽名：